

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
760

Deuxième édition
Second edition
1989-11

Bornes plates à connexion rapide

Flat, quick-connect terminations

© CEI 1989 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

U

• Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
Avant-propos	4
Articles	
1. Domaine d'application	6
2. Références normatives	6
3. Définitions	6
4. Classement en groupes	8
5. Valeurs de courant	8
6. Marquage	8
7. Dimensions	8
8. Essais de type	22
9. Conditions d'essai	22
10. Eprouvettes	22
11. Examen visuel	28
12. Examen de dimension et de masse	28
13. Résistance de contact - Méthode du courant d'essai spécifié	28
14. Echauffement	28
15. Charge en courant cyclique	38
16. Forces d'insertion et d'extraction	38
17. Résistance à la traction (connexion sertie)	40
ANNEXE A — Dynamomètre d'essai des clips à connexion rapide	50

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
Clause	
1. Scope	7
2. Normative references	7
3. Definitions	7
4. Classification into groups	9
5. Values of current	9
6. Marking	9
7. Dimensions	9
8. Type tests	23
9. Test conditions	23
10. Test specimens	23
11. Visual examination	29
12. Examination of dimension and mass	29
13. Contact resistance – Specified test current method	29
14. Temperature rise	29
15. Current loading, cyclic	39
16. Insertion and withdrawal forces	39
17. Tensile strength (crimped connection)	41
APPENDIX A — Force gauge for testing quick-connect female connectors	51



COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

BORNES PLATES À CONNEXION RAPIDE

AVANT-PROPOS

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 4) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses recommandations.

La présente norme internationale a été établie par le Sous-Comité 48B: Connecteurs, du Comité d'Etudes n° 48 de la CEI: Composants électromécaniques pour équipements électroniques.

Cette deuxième édition remplace la première édition de la CEI 760 (1983).

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapports de vote
48B(BC) 117 48B(BC) 161	48B(BC) 127 48B(BC) 178

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FLAT, QUICK-CONNECT TERMINATIONS

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.
- 4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no responsibility when an item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

This International Standard has been prepared by Sub-Committee 48B: Connectors, of IEC Technical Committee No. 48: Electromechanical components for electronic equipment.

This second edition replaces the first edition of IEC 760 (1983).

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule	Reports on Voting
48B(CO) 117 48B(CO) 161	48B(CO) 127 48B(CO) 178

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Reports indicated in the above table.

BORNES PLATES À CONNEXION RAPIDE

1. Domaine d'application

La présente norme internationale est applicable aux bornes plates à connexion rapide comportant une languette avec trou ou empreinte et un clip d'accouplement. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé que les bornes à connexion rapide non couvertes par le domaine d'application de cette norme ne soient pas interchangeables avec celles qui sont décrites dans l'article 4. La présente norme établit des exigences uniformes pour les dimensions, caractéristiques de fonctionnement et programme d'essais.

2. Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente norme internationale. Au moment de la publication de cette norme, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés sur cette norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des normes internationales en vigueur à un moment donné.

CEI 68-1 (1988): Essais d'environnement, Première partie: Généralités et guide.

CEI 68-2-20 (1979): Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Deuxième partie: Essais-Essai T: Soudure.

CEI 512-2 (1985): Composants électromécaniques pour équipements électroniques: procédures d'essai de base et méthodes de mesure, Deuxième partie: Examen général, essais de continuité électrique et de résistance de contact, essais d'isolement et essais de contrainte diélectrique.

CEI 512-3 (1976): Troisième partie: Essais de courant limite.

CEI 512-5 (-): Cinquième partie: Essais d'impact (composants libres), essais d'impact sous charge statique (composants fixes), essais d'endurance et essais de surcharge.

CEI 512-7 (1988): Septième partie: Essais de fonctionnement mécanique et essais d'étanchéité.

CEI 512-8 (1984): Huitième partie: Essais mécaniques des connecteurs, des contacts et des sorties.

FLAT, QUICK-CONNECT TERMINATIONS

1. Scope

This International Standard is applicable to flat quick-connect terminations consisting of male tabs with hole or dimple detents and the mating female connectors. For reasons of safety, it is recommended that quick-connect terminations beyond the scope of this standard shall not be interchangeable with those listed in Clause 4. This standard establishes uniform requirements for the dimensions, performance characteristics and test program.

2. Normative references

The following standards contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this International Standard. At the time of publication, the editions indicated were valid. All standards are subject to revision, and parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the standards listed below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 68-1 (1988): Environmental testing, Part 1: General and guidance.

IEC 68-2-20 (1979): Basic environmental testing procedures, Part 2: Tests—Test T: Soldering.

IEC 512-2 (1985): Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods, Part 2: General examination, electrical continuity and contact resistance tests, insulation tests and voltage stress tests.

IEC 512-3 (1976): Part 3: Current-carrying capacity tests.

IEC 512-5 (—): Part 5: Impact tests (free components), static load tests (fixed components), endurance tests and overload tests.

IEC 512-7 (1988): Part 7: Mechanical operating tests and sealing tests.

IEC 512-8 (1984): Part 8: Connector tests (mechanical) and mechanical tests on contacts and terminations.